

# Общая физика

УДК 535.4

## Рассеяние ультракоротких лазерных импульсов на металлических наночастицах

В. А. Астапенко

*Представлен теоретический анализ рассеяния ультракоротких лазерных импульсов на металлических наносферах, помещенных в диэлектрическую среду. На основании развитого подхода в рамках справедливости теории возмущений проведен расчет основных характеристик рассматриваемого процесса как функции параметров задачи. Особое внимание уделено влиянию длительности импульса и фазы несущей по отношению к огибающей на спектр возбуждения рассеяния и величину квантового выхода.*

PACS: 42.65.Re

**Ключевые слова:** ультракороткий лазерный импульс, металлические наносферы, рассеяние излучения, квантовый выход, фазовые эффекты.

### Введение

В последнее десятилетие стремительно развивается технология генерации ультракоротких лазерных импульсов фемто- и аттосекундного диапазона длительности с контролируемой формой огибающей [1—3]. В этой связи возникает вопрос о специфических особенностях взаимодействия ультракоротких импульсов с веществом и возможности их практического использования. Среди таких возможностей важное место занимает управление вероятностью фотопроцессов с помощью изменения фазы несущей частоты по отношению к огибающей импульса (СЕ-фаза — carrier-envelope phase). В англоязычной литературе данный способ управления называется фазовым контролем. Фазовый контроль экспериментально наблюдался во внешнем фотоэффекте с поверхности золотой фольги под действием лазерных импульсов с управляемой СЕ-фазой [4], а также в работах, посвященных динамике молекулярной изомеризации [5], скорости фотодиссоциации молекул [6], генерации высоких гармоник [7] и в ряде других.

Теория взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с веществом развивалась как на основе численного решения уравнения Шредингера [8] или уравнения для вектора Блоха [9], так и с помощью аналитических методов [10]. В работе [11], например, исследовалась динамика двухуровневой системы, возбуждаемой субцикловым электромагнитным импульсом, на основе комбинации аналитического, пертурбативного и численного подходов.

Рассматриваемые в статье металлические наночастицы перспективны для биомедицинских применений в качестве наномаркеров, а также как наносенсоры химического состава, электрического заряда, внешнего электрического поля и т. д. [12]. В отличие от молекул красителей, цвет которых определяется фотопоглощением и люминесценцией, доминирующим фотопроцессом в случае металлических наночастиц является рассеяние излучения. Поэтому установление специфических черт рассеяния ультракоротких лазерных импульсов актуально для разработки физической основы использования наночастиц в атто- и фемтосекундном диапазоне длительностей.

Статья посвящена анализу рассеяния ультракоротких лазерных импульсов на металлических наносферах, помещенных в диэлектрическую матрицу. Рассматривается область интенсивностей лазерного излучения, в которой справедливо описание фотопроцесса в рамках теории возмущений, а также исследуется спектральный диапазон вблизи плазмонного резонанса, который наиболее важен для практических применений металлических наночастиц.

### Вероятность фотопроцесса за все время действия ультракороткого импульса

Для относительно длинных лазерных импульсов, когда длительность импульса  $\Delta t_p$  существенно превышает период колебания электромагнитного поля на несущей частоте  $T = 2\pi/\omega$  (т. е.  $\Delta t_p \gg T$ ), фотопроцессы в рамках теории возмущений обычно описываются с помощью вероятности в единицу времени  $w$ . Вероятность в единицу времени удобно выразить через сечение процесса в монохроматическом поле  $\sigma(\omega)$  в соответствии с хорошо известной формулой

Астапенко Валерий Александрович, заведующий кафедрой. Московский физико-технический институт. Россия, 141700, г. Долгопрудный МО, Институтский пер., 9. Тел. (495) 408-49-77. E-mail: astval@mail.ru

Статья поступила в редакцию 25 августа 2010 г.

$$w = \sigma(\omega) \frac{I}{\hbar \omega}, \quad (1)$$

где  $I$  — интенсивность излучения на частоте  $\omega$ .

Спектральная интенсивность излучения на "текущей" частоте  $\omega'$  выражается на основе [13] в виде следующего равенства:

$$\frac{dI}{d\omega'} \equiv I(\omega') = \frac{c}{(2\pi)^2} \times \int_{-\infty}^{\infty} \langle E_i(t) E_i(t+\tau) \rangle_t \exp(i\omega'\tau) d\tau, \quad (2)$$

где  $c$  — скорость света, угловые скобки обозначают усреднение по времени, а по дважды повторяющимся индексам предполагается суммирование.

В реальности распределения  $I(\omega')$  имеет конечную спектральную ширину  $\Delta\omega \neq 0$ . До создания лазеров, генерирующих ультракороткие импульсы, можно было полагать, что  $\Delta\omega \ll \omega$ , поскольку  $\Delta t_p \gg T$ . Соответствующее излучение является квазимонохроматическим, для него легко обобщить формулу (1), переписав ее в виде

$$w = \int \sigma(\omega') \frac{I(\omega')}{\hbar \omega'} d\omega', \quad (3)$$

где  $I(\omega')$  — спектральная интенсивность излучения (2).

Использование для описания фотопроцессов вероятности в единицу времени (1), (3) и интенсивности излучения (2) предполагает усреднение по промежутку времени  $\Delta t \gg T$ . Очевидно, что такое усреднение становится неадекватным для ультракоротких импульсов, длительность которых может быть меньше периода на несущей частоте. Поэтому нужно оперировать понятием вероятности процесса за все время действия импульса  $W$  и интенсивностью излучения, зависящей от времени  $I(t)$ . Спектральная интенсивность в этом случае будет даваться формулой, аналогичной равенству (2), в котором отсутствует усреднение по времени:

$$I(\omega', t) = \frac{c}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} E_i(t) E_i(t+\tau) \exp(i\omega'\tau) d\tau. \quad (4)$$

Тогда можно формально ввести зависящую от времени вероятность процесса в единицу времени:

$$w(t) = \int \sigma(\omega') \frac{I(\omega', t)}{\hbar \omega'} d\omega', \quad (5)$$

через которую очевидным образом выражается вероятность процесса  $W$  за все время действия импульса излучения (в пределе теории возмущений  $W \ll 1$ ):

$$W = \int_{-\infty}^{\infty} w(t) dt = \int_0^{\infty} \sigma(\omega') \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I(\omega', t)}{\hbar \omega'} dt d\omega'. \quad (6)$$

Воспользуемся теперь равенством

$$\int_{-\infty}^{\infty} I(\omega', t) dt = \frac{c}{(2\pi)^2} |E(\omega')|^2, \quad (7)$$

где  $E(\omega')$  — фурье-образ напряженности электрического поля в лазерном импульсе.

Соотношение (7) можно получить из определения зависящей от времени интенсивности (4) путем разложения напряженности электрического поля в интеграл Фурье. Подставляя (7) в (6), для вероятности фотопроцесса за все время действия лазерного импульса находим следующее выражение:

$$W = \frac{c}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} \sigma(\omega') \frac{|E(\omega')|^2}{\hbar \omega'} d\omega'. \quad (8)$$

Формула (8) была получена в работе [10] для фотопоглощения в рамках последовательного квантово-механического рассмотрения на основании теории возмущений. В настоящей работе используем выражение (8) для описания рассеяния ультракороткого лазерного импульса. Тогда под величиной  $\sigma(\omega')$  нужно понимать спектральное сечение рассеяния излучения  $\sigma_{scat}(\omega')$ .

Для вероятности рассеяния излучения на заданной частоте  $\omega'$  за все время действия ультракороткого лазерного импульса из соотношения (8) следует равенство:

$$\frac{dW_{scat}}{d\omega'} = \frac{c}{(2\pi)^2} \sigma_{scat}(\omega') \frac{|E(\omega')|^2}{\hbar \omega'}. \quad (9)$$

Отсюда для дифференциальной по частоте энергии рассеянного излучения имеем:

$$\frac{d\Delta E_{scat}}{d\omega'} = \frac{c}{(2\pi)^2} \sigma_{scat}(\omega') |E(\omega')|^2. \quad (10)$$

В формулах (9) и (10) под частотой  $\omega'$  понимается частота рассеянного монохроматического излучения в отличие от несущей частоты ультракороткого импульса  $\omega$ .

Для интегральной энергии рассеянного излучения при воздействии ультракороткого импульса на мишень из равенства (10) следует, что

$$\Delta E_{scat} = \frac{c}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} \sigma_{scat}(\omega') |E(\omega')|^2 d\omega'. \quad (11)$$

Полученные выражения (9)—(11) описывают поглощение ультракороткого импульса с заменой сечения рассеяния на сечение поглощения.

### Сечение рассеяния излучения на металлической сфере

Рассмотрим рассеяние ультракороткого лазерного импульса на металлических наносферах, помещенных в однородную среду (матрицу). Для того чтобы воспользоваться полученными в предыдущем разделе формулами, необходимо знать сечение рассеяния излучения на соответствующей мишени. Воспользуемся для этого результатом теории Ми [14], который дает разложение сечения рассеяния на металлической сфере в виде следующего ряда

$$\sigma_{scat}^{(Mie)} = \frac{2\pi c^2}{\varepsilon_m \omega^2} \times \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \left\{ |a_n(x, mx, m)|^2 + |b_n(x, mx, m)|^2 \right\}, \quad (12)$$

где  $x = k r_s = \sqrt{\varepsilon_m} \frac{\omega}{c} r_s$  и  $m = \sqrt{\varepsilon_s(\omega)/\varepsilon_m}$  — два основных параметра теории;  $\varepsilon_s(\omega)$ ,  $\varepsilon_m$  — диэлектрические проницаемости материала наносферы и матрицы. Коэффициенты разложения  $a_n$  и  $b_n$  равны:

$$a_n(x, y, m) = \frac{\psi'_n(y)\psi_n(x) - m\psi'_n(x)\psi_n(y)}{\psi'_n(y)\zeta_n(x) - m\zeta'_n(x)\psi_n(y)}, \quad (13)$$

$$b_n(x, y, m) = \frac{m\psi'_n(y)\psi_n(x) - \psi'_n(y)\psi'_n(x)}{m\psi'_n(y)\zeta_n(x) - \zeta'_n(x)\psi_n(y)}, \quad (14)$$

где

$$\psi_n(z) = z j_n(z) = \sqrt{\frac{\pi z}{2}} J_{n+1/2}(z); \quad (15)$$

$$\zeta_n(z) = z h_n^{(1)}(z) = \sqrt{\frac{\pi z}{2}} H_{n+1/2}^{(1)}(z) \quad (16)$$

функции, введенные Дебаем;

$j_n(z)$ ,  $h_n^{(1)}(z)$  — сферические функции Бесселя и Ханкеля;

$J_{n+1/2}(z)$  и  $H_{n+1/2}^{(1)}(z)$  — функции Бесселя и Ханкеля полуцелого порядка.

Диэлектрическая проницаемость металлической сферы является комплексной величиной. Она может быть выражена через действительную  $n_s(\omega)$  и мнимую  $\kappa_s(\omega)$  части показателя преломления металла:

$$\varepsilon_s(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega) = [n_s(\omega)]^2 - [\kappa_s(\omega)]^2 + 2in_s(\omega)\kappa_s(\omega). \quad (17)$$

Для функций  $n_s(\omega)$  и  $\kappa_s(\omega)$  используем экспериментальные данные, полученные в работе [15]. Диэлектрическую проницаемость матрицы полагаем действительной и не зависящей от частоты излучения. Использование объемных значений диэлектрической проницаемости для наносферы оправдано, поскольку в работе [12] показано, что такой подход обеспечивает хорошее соответствие с экспериментальными данными для сечения рассеяния излучения на золотых и серебряных наносферах.

Для сечения экстинкции излучения на металлической сфере теория Ми дает:

$$\sigma_{ext}^{(Mie)} = \frac{2\pi c^2}{\varepsilon_m \omega^2} \times \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \text{Re} \{ a_n(x, mx, m) + b_n(x, mx, m) \}. \quad (18)$$

Величина  $\sigma_{ext} I_0$  представляет собой мощность излучения, удаляемую из падающего на наночастицу светового луча интенсивности  $I_0$ , за счет поглощения и рассеяния. Отношение сечения рассеяния к сечению экстинкции называется *квантовым выходом*  $\eta_\sigma = \sigma_{scat}/\sigma_{ext}$ . Квантовый выход характеризует относительную величину удаляемой из светового луча мощности, которая идет на рассеяние излучения, т. е. может быть зарегистрирована фотоприемником. Подставляя сечение экстинкции (18) в формулу (11), можно найти, какая энергия будет удалена из лазерного импульса в результате его взаимодействия с металлической наносферой.

### Импульс лазерного излучения

Предположим, что напряженность электрического поля лазерного импульса изменяется со временем по закону:

$$E(t) = E_0 \exp(-t^2/\Delta t^2) \cos(\omega t + \varphi), \quad (19)$$

где параметр  $\Delta t$  пропорционален длительности импульса  $\Delta t_p$ ;

$\varphi$  — фаза несущей по отношению к огибающей, которая, как уже было сказано, в англоязычной литературе называется *carrier-envelope phase* (СЕ-фаза).

Покажем [10], что между параметром  $\Delta t$  и длительностью импульса гауссовой формы (19) существует соотношение:

$$\Delta t_p = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Delta t \cong 1,253 \Delta t. \quad (20)$$

При выполнении соотношения (20) в пределе длинных импульсов в рамках теории возмущений